



Seminar Atomic Force Microscope (AFM)

Satu seminar berkenaan Atomic Force Microscope (AFM) telah dianjurkan pada 14 Ogos 2014 oleh Fakulti Sains dan Sumber Alam dengan kerjasama Crest Nanosolutions (M) Sdn. Bhd. Seminar ini telah dijalankan di Bilik Seminar, Fakulti Sains dan Sumber Alam. Seramai 40 orang peserta daripada kalangan pensyarah dan pelajar pascasiswazah telah mengambil bahagian. Tujuan seminar ini diadakan adalah untuk memberikan pendedahan kepada pensyarah dan para pelajar pascasiswazah tentang teknik karakteristik yang terkini menggunakan AFM. Disamping itu, teori tentang mekanisma AFM



juga turut di kongsi bersama oleh wakil dari Crest Nanosolutions. Di sebelah petangnya, peserta berpeluang menimba pengalaman untuk hands on menggunakan AFM untuk menganalisis sampel masing-masing. Diharapkan perkongsian ilmu ini dapat dimanfaatkan oleh para pensyarah dan pelajar yang terlibat dengan penyelidikan menggunakan AFM ini.